3次元収束型プラズマフォーカスダイオードのイオンビームの収束性の評価

今成 一雄·江 偉華*·升方 勝巳**·八井 淨***

Evaluation of focusing characteristics of spherical plasma focus diode

Kazuo IMANARI

Jiang WEIHUA* · Katsumi MASUGATA** · Kiyoshi YATSUI***

1. はじめに

大強度パルス軽イオンビーム(Intense Pulsed Light Ion Beam:LIB)は、ターゲット内での飛程が 短いために固体ターゲットとの相互作用によって高温・ 高密度のプラズマを生成する。それゆえ、慣性核融合 (Inertial Confinement Fusion:ICF)のエネルギー ドライバー¹¹や材料科学^{2~11}への応用が期待されている。 イオンビーム発生用ダイオードの開発においては、非 常に小さいターゲット表面に LIB を収束させて、高 電力密度を達成する事が大きな課題となっている。

ターゲット上で収束可能なビーム電力密度 Pは,

$$p = rac{J_i V_d}{\left(\phi^2 + \delta^2
ight)} rac{\Phi}{4\pi}$$

で与えられる⁵⁾。ここで、 J_i :陽極表面のイオン電流 密度、 V_a :ダイオード電圧、 Φ :ターゲットから見た ビームの照射立体角、 ϕ :ビームの局所的発散角、 δ : ビームの軌道ずれ角、である。よって、ビーム電力の 高密度化には、 J_i や V_a そして Φ の増大や、 ϕ 及び δ の 低減が必要と成る事が判る。陽極より、より多くのイ オン電流を引出し、かつ電子電流による陰極-陽極間 の短絡を防ぐために、電極間には絶縁磁場が必要とな る。イオンダイオードは、この絶縁磁場の印加方法に より外部から磁場が供給される"外部磁場絶縁型"と 電子電流が絶縁磁場を形成する"自己磁場絶縁型"と に大別される。また、ビームの照射立体角を増大させ るために、イオンダイオードの陽極と陰極とを球面状 にして、LIBを幾何学的に収束させる手段が取られ

*:長岡技術科学大学電気系講師
*:長岡技術科学大学電気系助教授
**:長岡技術科学大学電気系教授

る。しかしながら、外部磁場絶縁型のダイオードでは、 ビームの照射立体角は絶縁磁場発生装置の配置により 大きな制限を受けてしまい、任意の大立体角を得る事 は難しい。我々は、大立体角を得るために、新しいタ イプの自己磁場絶縁・3次元収束型球状プラズマフォー カスダイオード(Spherical Plasma Focus Diode: SPFD)を開発した。

ここでは、SPFDのLIB収束特性の実験結果とシ ミュレーション結果とについて報告する。2章では、 SPFDの構造と特徴について、3章では実験装置及び 測定装置について、そして4章では、実験結果とその 検討について述べる。5章では、シミュレーションに 使用したPIC (Particle in Cell)コードについて、6 章では、その結果と検討について述べ、最後に7章で それらを総括する。

2. SPFD

SPFDは、3次元収束型の自己磁場絶縁イオンダイ オードである^{6~8)}。本ダイオードは、図1に示すよう に半球形状を持つアノードとカソードとで構成されて いる。アノードのカソード側表面には、2軸に対して 同心円となるように溝(アノードグループ)が掘られて おり、そこにイオン源となるエポキシ樹脂が充填され ている。このアノードグルーブは曲率中心に対して、 回転(θ)方向に $0-2\pi$ 、仰角(ψ)方向に $\pi/6-\pi/2$ の立体角を持つ。標準的なカソードには、ビーム透過 率が約5%となるように、直径1mmの穴が多数開けら れている。基本的なセッティングでは、アノード半径 は $R_{z}=25mm$ 、カソード半径は $R_{z}=20mm$ で、アノードと カソードの曲率中心が同一となるように配置される。 本ダイオードは、パルスパワー発生装置から

本ダイオートは、ハルスハリー先生表 直から アノード・カソード間(電極間ギャップ)に高電圧パル ス(数MV,数+ns)が印加される事により動作する。 カソードより放出された電子は自己磁場によってv×B。 方向のローレンツ力による偏向を受け、その軌道はダ イオード下流方向(図中、右方向)へとピンチしてアノー ドから絶縁される。アノードから放出されたイオンは、 電極間ギャップで加速され、エネルギーを得て LIB となり、ダイオードの幾何学的な収束点(Focusing Point、曲率中心に一致する)に収束する。このとき、 イオンは電子と比較して質量が十分に重いため、自己 磁場による偏向をほとんど受けない。

SPFDは,外部磁場絶縁型のダイオードと比較して, 以下の特徴を持つ。

- 外部磁場コイルが不要なので、非常にシンプル でコンパクトな構造である。
- 2) 非常に大きなビーム収束立体角が確保できる。
- 3) 対称構造であるため、ビームを収束させ易い。





3. 実験装置·測定系

実験は長岡技術科学大学 粒子ビーム工学センター に設置されたパルスパワー発生装置"ETIGO-II"で行 われた⁹⁾。図2に"ETIGO-II"の概略図を,表1に各部 パラメータを示す。本装置は、マルクス発生器(Marx Generator),エネルギー蓄積コンデンサー(Energy Storage Capacitor:ESC),同軸型パルス整形線路 (Pulse Forming Line:PFL)、インピーダンス変換器 (Impedance Conversion Line:ICL)、から構成される。 マルクス発生器のコンデンサを並列に充電した後、直 列に接続・放電させる事で、高電圧パルスが発生する。



図1 3次元収束型プラズマフォーカスダイオード概略図



図 2 大強度パルス発生装置 "ETIGO-II"

3次元収束型プラズマフォーカスタ	「イオードのイ	オンビーム	4の収束性の評価
------------------	---------	-------	----------

表	1 ETIGOーIIのパラメータ
Marx Generator Capacitor Gap Switch	3MV, 160kJ, 40Stage ±75kV, 1.42µF Field Distortion Type Gas Gap Switch(SF6,Air)
Energy Storage Capacitor Main Switch	3MV, 24nF, 5Ω 1ch Self Breakdown Gas Gap Switch(SF ₆)
Pulse Forming Line Output Switch	3MV, 1.7Ω Water 12ch
Impedance Conversion Line	1.7Ω→6.5Ω
Output Parameter	3MV, 460kA, 50ns, 70kJ, 1.4TW
Dimension	$19^{L} \times 2.9^{W} \times 3.1^{H}$, 110 ton

この出力は一旦 ESC で蓄積され、立ち上がりのより 急峻なパルスとなって、PFL に送られ、さらに短パ ルスに波形整形される。そして、ICLを通して昇圧さ れた大強度パルスが、ダイオードに供給される。マル クス発生器の充電電圧が Va=±75kVの時、最終的な 出力として、出力電圧 V=3MV、出力インピーダン ス $Z=6.5\Omega$,出力電力P=1.4TW,パルス幅 $\tau=50$ ns, 出力エネルギー E=70kJ, が得られる。ダイオード に供給される電圧(ダイオード電圧: Va)は, ICL 出力 端に取り付けられた容量分圧器(Capacitive Divider) で、ダイオードに流れる電流(ダイオード電流:L)は、 ETIGO-II 終端に取り付けられたピックアップコイル (Pickup Coil)で、各々測定される。電極間ギャップ に印加される正味の電圧は、ダイオード電圧をダイオー ドでの電圧降下で補正(インダクタンス補正)する事に よって得られる。

LIBの収束性を評価するために、時間積分型のラザ フォード散乱ピンホールカメラを使用してビームの収





典型的なダイオード動作波形 义 4

- 99 -

束サイズを測定した。図3は、測定装置を示す。カソードには、特定の入射角度(ϕ =50,60,70,80 deg)にのみ穴が開けられ、アパーチャとして機能する。アパーチャから入射した LIB は、曲率中心を含む r-z 平面に設置された散乱膜(7 μ m^tAℓ)でラザフォード散乱され、ピンホールカメラ(ピンホール径0.1mm^t)を通して、後方の CR-39 トラックディテクタ上に結像し、記録される。このとき、CR-39 表面に 2 μ m^tのマイラーフィルムを設置することで、陽子のみが検出・評価される。

4. 実験結果・検討

図4は、ダイオードの典型的な動作波形を示す。こ こで、Vaはインダクタンス補正されたダイオード 電圧、Laはダイオード全電流、Zaはダイオードイン ピーダンスである。ダイオード電圧が最大値のとき、 ダイオードインピーダンスは 6.8Ω で、ETIGO-II と SPFD とのインピーダンスマッチングが取れている 事を示している。

図5は、ラザフォード散乱ピンホールカメラで計測 されたトラック密度分布である。同図(a),(b)はそれ ぞれ、z方向とr方向の分布を示し、原点は曲率中心 に一致している。LIBの入射角度が特定できないため、 ラザフォード散乱確率によるデータの補正は行われて いない。図5(a)より、z方向のLIBの収束長は6.0mm (FWHM)で、ダイオード下流方向に2.5mm ずれた位 置に収束している事が判る。このずれは、自己磁場に よる偏向が原因であると考えられる。図5(b)より、r 方向では曲率中心付近に最大値を持ち、収束径は4.5 mm(FWHM)である事が判る。また、ダイオードセッ ティングのずれが原因で、密度分布が2つの山を持つ と推定される。以上の結果から、LIBはz軸上で、円 柱形状に収束していると評価できる。

5. シミュレーションコード

SPFDが回転対称形である事を利用して、2次元モ デルのPICコード^{10,11)}を開発した。図6は、モデルを 示す。モデルは2次元であるが、内部の計算では回転 方向の運動も考えているので、コードは2.5次元と呼 ばれる。空間メッシュは、1辺0.2mmの正方形、計算 時刻の刻みは0.3psである。コードは電磁界コードで Maxwellの方程式と粒子の相対論的な運動を含む。 シミュレーション粒子は電子と陽子とで、各々は空間 の電磁場を発生させる源となる。

本コードでは、ビームの発散の原因として、初期熱 エネルギーを考えている。図7は、初期熱エネルギー



図5 a)z方向と、b)r方向のトラック密度分布



図6 ダイオードモデル



図7 初期熱エネルギーベクトル設定モデル

の設定モデルを示す。ベクトル空間は半分で、その境 界は曲率中心迄の距離を半径とする円の接線である。 ベクトルの大きさは一定値とされ、その方向αは発生 確率が一様な乱数によって決定されている。

SPFD のシミュレーションモデルには、実験装置と 比較して以下の違いがある。

- 実験で用いられているアノードにはイオン源となるエポキシが満たされたグループがあるが、シミュレーションではグループは存在しない。イオンはアノード表面から均等に発生するとされる。
- 実験で用いられているカソードは、たくさんの 穴が開けられ、有限のビーム透過率(~5%)を持 つが、シミュレーションではビーム透過率は100 %として扱われている。
- PICコードに依るシミュレーションであるため、 プラズマの流体としての特性(例えば、プラズマ 拡散)が含まれていない。
- シミュレーションにおいて、アノードから引き 出される粒子の量は、そこに掛かる電界強度のみ によって決定され、イオン源に与えられるエネル ギーは考慮されていない。つまり、プラズマの発 生機構は含まれていない。

6. シミュレーション結果・検討

図8は、典型的なダイオード電圧波形(V_a)とダイオード電流波形(I_a)とを示す。各々の最大値は、 $V_a \sim 960$ kV, $I_a \sim 160 kA$ であり、ダイオードインピーダンス



図8 典型的なシミュレーション波形

はZ₄~6.0Ωと計算される。これらの値は,実験結果 と非常に良く一致している。シミュレーション時間が 実験と比較して約1/10と短くなっているのは,シミュ レーションでは粒子のライフタイムが約1*ns*と非常に 短く,長時間のシミュレーションは本質的な意味を持 たないためである。

図9は、z軸に到達した粒子数の分布を示す。図に おいて、縦軸は最大値で規格化され、原点 z=0 は曲 率中心に一致している。時刻 t は、シミュレーション を開始してからの時刻で、図8の時間軸に一致してい る。横軸の分解能は、0.1mm となっている。また、初 期熱エネルギーは、20eVである。ダイオード電圧が ほぼ0Vとなる時刻 t=8.1nsにおいて、粒子は2.5mm (FWHM)の幅で収束し、そのピークは下流方向に2.0 mmずれている事が判る。ピークのずれは実験結果と良 く一致しているが、収束幅は実験結果の約1/2の値と なっている。この原因としては、シミュレーションコー ドにイオン源の揺らぎやプラズマ拡散が含まれていな い事が挙げられる。

図10は、最大収束点(z=2.0mm)における粒子のr軸 方向分布を示す。縦横軸、時刻、分解能は、図9に準 ずる。時刻 t=8.1 ns において、粒子は 0.4 mm (FWHM)の直径で収束している事が判る。また分解 能を考慮すると、それ以下である可能性もある。"5. シミュレーションコード"で述べたように、コードは 2.5次元でありr方向の分布は直接観測できない。そ こで、最大収束点を横切る粒子数からその分布を推定 している。それ故に、実験結果と大きな差が出たと考 えられる。図9、図10から、ビームは円筒状に収束し ている事が判る。これは実験結果に一致している。



図9 r方向のイオン数密度分布図

7.まとめ

実験とシミュレーションとから SPFD のイオンビー ムの収束性を評価して,以下の結論が得られた。

- ラザフォード散乱ピンホールカメラの実験結果 より、SPFDのLIBの収束サイズは4.5mm⁴×6.0 mmで、そのピークはダイオード下流方向に2.5mm ずれている事が判った。
- 初期熱エネルギー 20 eVを仮定した PIC コード シミュレーションでは、SPFD の LIB の収束サ イズは 0.4mm⁴×2.4mm で、そのピークはダイオー
- ド下流方向に 2.0mm ずれている結果が得られた。 3. 初期熱エネルギーだけで、イオンビームの発散 の発生機構を表現するには不十分であり、他の要 因を考える必要がある事が明らかになった。
- アノードプラズマの不均一性や、プラズマ膨脹 現象を含んだ PIC コードの開発が必要であると 言える。

最後に、本研究は文部省の"平成7年度情報処理関 係内地研究員制度(平成7年5月1日~平成8年2月 29日)"の下で行われた。



図10 z方向のイオン数密度分布図

参考文献

- 1) J.P.VanDevender et al.: Science 232, 831(1986).
- K.Yatsui *et al.*:Proc. 11th Int'l Conf. on Plasma Phys. and Controlled Nucl. Fusion Res. Kyoto, Japan <u>IAEA-CN-47/B-III-9</u>(1986).
- 3) K.Yatsui et al.: Phy. Plasma 1, 1730(1994).
- 4) K.Yatsui *et al.*: Appl. Phys. Letters <u>67</u>, 1214 (1995).
- 5) J.P.VanDevender *et al.*:Laser and Part. Beams 3, 93(1985).
- 6) W.Jiang et al.: Jpn. J. Appl. Phys. <u>32</u>, L752 (1993).
- 7) W.Jiang et al.: Phys. Plasmas 2, 325 (1995).
- 8) W.Jiang *et al.*:Laser and Part. Beams <u>13</u>, 343 (1995).
- 9) A.Tokuchi at el.:Proc. 2nd Int'l Symp. on Inertical Confinement Fusion Res. by High-Power Particle Beams, ed. by K. Yatsui (Nagaoka Univ. of Technology), 430(1986).
- 10) C.K.Birdsall, A.B.Langdon:Plasma Physics via Computer Simulation, Adam Hilger(1991).
- 田中 實,山本良一:計算物理と計算化学,海文 堂(1988).

(受理年月日 1996年 9 月24日)